

日本分析化学会 X 線分析研究懇談会第 268 回例会

来る 9 月 11 日 (水) ~13 日 (金) に千葉大学西千葉キャンパスにおいて開催されます
「日本分析化学会第 68 年会」<http://conference.wdc-jp.com/jsac/nenkai/68/index.html>
の期間中に、X 線分析研究懇談会による講演会 (第 268 回例会) を、開催いたします。

今回は、放射光を利用した蛍光 X 線分析や表面 X 線散乱の手法開発、また関連する材料
研究を中心に、独自性の高い研究を 30 年以上にわたり展開してこられた桜井健次先生
(物質・材料研究機構) によるご講演を企画いたしました。桜井先生のアイディアあふれ
るご講演を伺うことのできる限られた機会になりますので、皆様お誘いあわせの上ぜひ
ご参集ください。

記

日時：2019 年 9 月 11 日 (水) 15:15~16:15

場所：千葉大学西千葉キャンパス・K 会場 (総合校舎 G2~G5 号館のどこか)

※詳しい教室等は、後日年会ホームページか、当日現地にてご確認ください。

題目：「奥行き・広がりのある分析について」

講演者：桜井健次先生 (国立研究開発法人 物質・材料研究機構 (NIMS))

講演番号：K1106 (K 会場、初日午後 6 番目)

◎本講演のみをご聴講の場合、年会への参加登録は不要です。

皆様のご参加をお待ち申し上げます。

問合先：江場宏美 heba@tcu.ac.jp

〒158-8557 東京都世田谷区玉堤 1-28-1

東京都市大学 工学部 エネルギー化学科

TEL/FAX:03-5707-1261(直通) または TEL:03-5707-0104(内線 3898)

以上